

DPALMS-LCA

SYSTEM

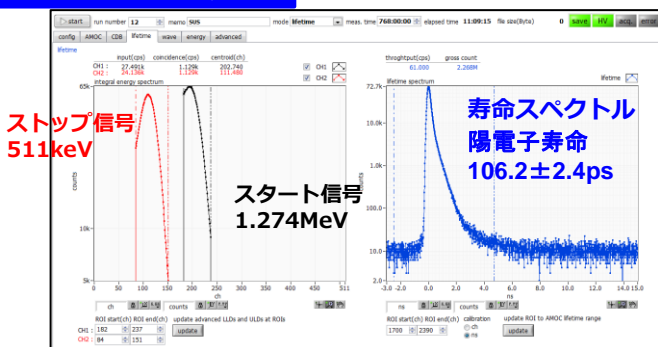
20220801

分子レベルのナノスケール空間構造を解析できる陽電子消滅法の測定に必要な計測・電源機器が一つになりました。**寿命測定**では2台のBaF₂シンチレータからの高速パルス信号を3GSPSのボードで取り込み寿命時間を算出。**ドップラー拡がり測定**では2台のGe半導体検出器からコインシデンスを取り波高値から2次元ヒストグラムを生成。さらにこれらの機器の組み合わせにより寿命と運動量の相関をとる**AMOC測定**も実現しました。



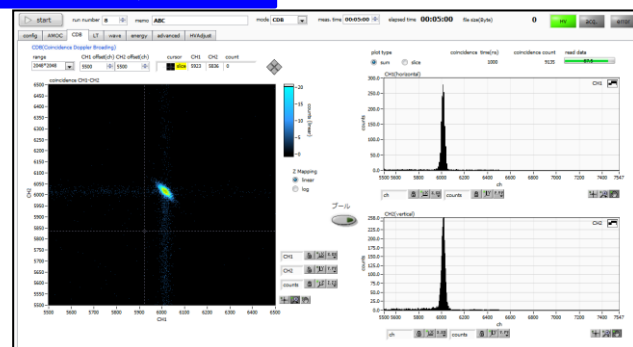
機能	1.寿命測定 2.シングルスペクトル測定、ドップラー拡がり測定 3.AMOC測定
ADC	2CH 3GspS 8-bit (寿命測定用) 2CH 100Msps 14-bit (ドップラー拡がり測定用)
時間分解能	< 180ps *検出器による
エネルギー分解能	1.69keV (1.33MeV@ ⁶⁰ Co)
寿命測定	標準物質ステンレス鋼 106.2±2.4 ps 陽電子寿命 標準物質石英ガラス 1.62±0.05 ns o-Ps寿命 測定時間レンジ <1100ns(8192ch) ※長寿命測定可
高圧電源	2CH: +5000V / CH (Ge半導体検出器用) *プリアンプ電源有 2CH: -4000V / CH (光電子増倍管用)
通信	イーサネット (TCP/IP)
寸法	【高さ】約32cm 【幅】約17cm 【奥行】約40cm

LIFETIME測定

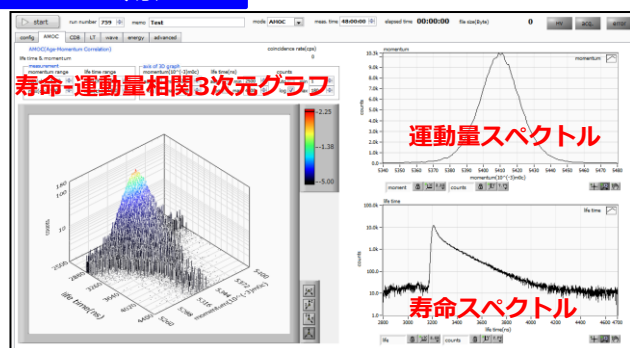


線源: ²²Na 試料: 標準物質ステンレス鋼

CDB測定



AMOC測定



試料: 石英ガラス

システム設置例



※写真はイメージです。
※記載内容は予告なく変更することがあります。

株式会社テクノエーピー

〒312-0012茨城県ひたちなか市馬渡2976-15

TEL:029-350-8011 FAX:029-352-9013

info@techno-ap.com



<http://www.techno-ap.com>

